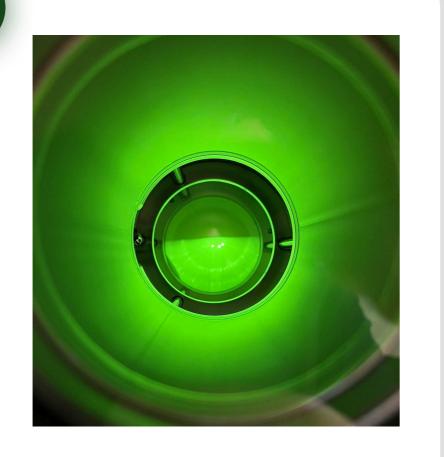


GUI application for **real-time in-situ RHEED profile analysis during MBE epitaxial growth** or other epitaxial growth methods.

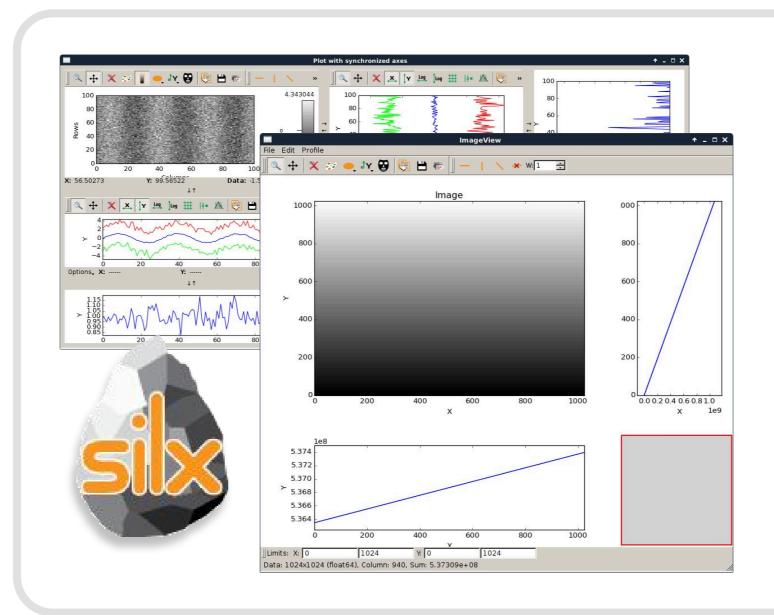
# Využití RHEED

#### **RHEED**

Reflective
High
Energy
Electron
Diffraction



 Statická ale i tzv. real-time analýza struktury krystalických vrstev

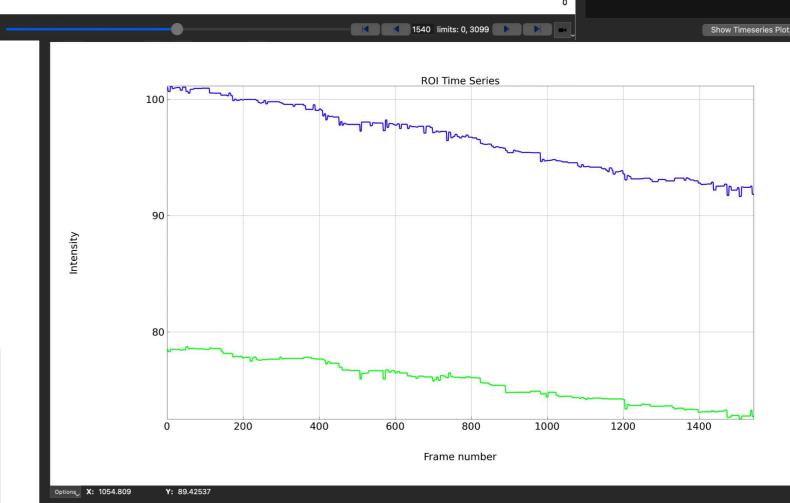


#### Knihovna silx

- Díky této knihovně jsme byli schopni jednoduše implementovat funkcionality jako jsou:
- zobrazování videozáznamu a možnost procházení tohoto záznamu
- vykreslování 1D grafů
- analýza intenzit v ROI atd.

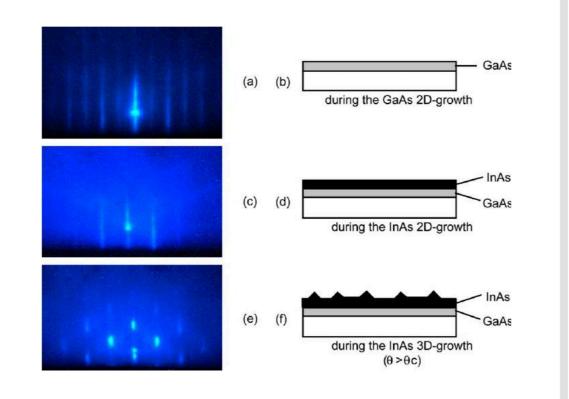
# Proces užívání aplikace

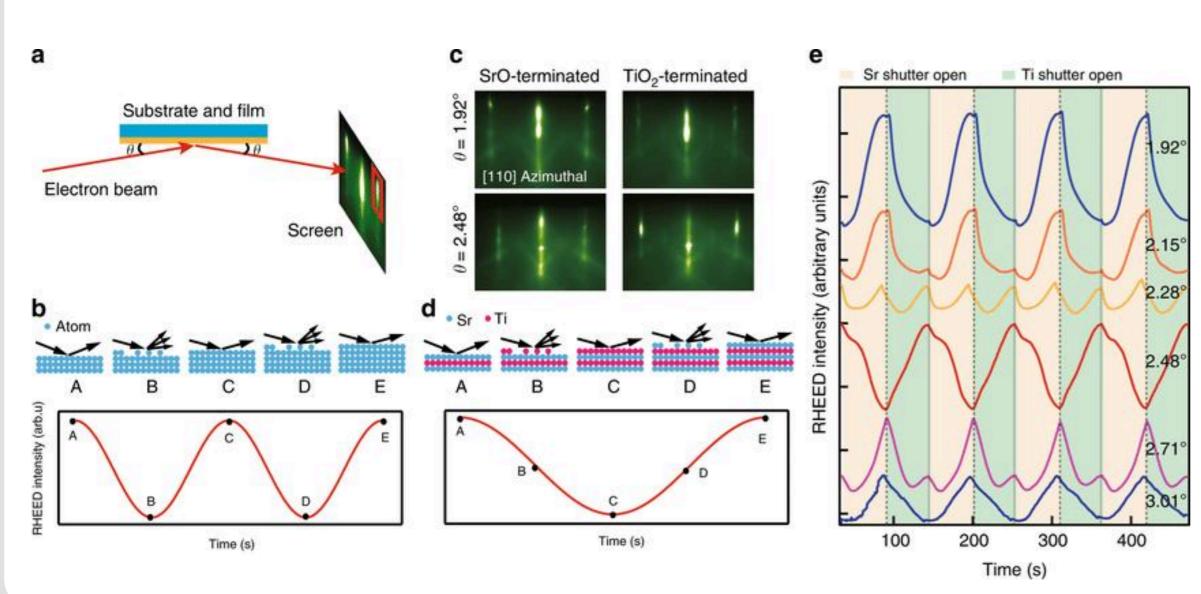
- **1** Zvolení zdroje obrazu: kamera nebo soubor .h5
- 2 Nastavení vlastností kamery nebo zvolení souboru
- 3 Rozmístění ROI nebo jejich načtení ze souboru .ini nebo .txt
- 4 Spuštění analýzy v reálném čase v timeseries grafu
- Možnost exportu/tisku/kopírování finálního grafu a možnost uložení ROI prvků dosouboru .ini/.txt pro opakování analýzy
- Studium výsledných grafů a případná úprava růstových podmínek pro další experimenty



### Analýza výsledných obrazců

- Každý difrakční vzor reprezentuje jiné stádium růstu monoatomární vrstvy (viz. obr. v sekci - Využití RHEED)
- Časosběr dat ve formě 1D grafu umožňuje analýzu a vývoj v průběhu celého růstu vrstev.





- Úspěšné navržení funkční aplikace řešící
  in-situ analýzu difrakčních vzorců v reálném
  čase s potenciálem na využití během růstu pomocí
  epitaxních metod jako je např. MBE.
- Plánované využití na pracovištích, kde je MBE využívána:
  - Výzkumná skupina spintroniky Tomáše Jungwirtha (procesní inženýrství - Ing. Filip Křížek, Ph. D.)
  - Výzkumná skupina sandwichových feroelektrických kompozitů Dr. Tima Verhagena
  - Výzkumná skupina Dr. Dominika Kriegnera
- Poděkování patří hlavně Dr. Dominiku Kriegnerovi za podporu a věcné odborné připomínky k aplikaci.



